低対称 Cr³⁺中心からの垂直型 EPR 信号における強度異常

蛭子 博志,荒川 正徳 物理学教室 (1994年9月2日受理)

Intensity Anomaly in Normal-Type EPR Signals from Low-Symmetry Cr³⁺ Centres

Hiroshi EBISU and Masanori ARAKAWA Department of Physics (Received September 2, 1994)

EPR mesurements have been made at room temperature on three trigonal Cr^{3+} centres (A,B, C) in hexagonal TlZnF₃ using an X-band EPR spectrometer. The determined parameters b⁹ in the spin-Hamiltonian are ± 78.8 , ± 2387.0 , $\pm 3496.9 \times 10^{-4} cm^{-1}$ for the centres A, B and C respectively. By rotating the sample keeping the c-axis normal to the external magnetic field, signal intensities of low- and high-field fine structure lines interchanged anomaly for the centres B and C. The characteristic angular variation of signal intensities for the centre C can be explained by ϕ -dependence of the transition probability for the fine structure lines. From the intensity measurements for the centres B and C the ratio of signal intensities between low- and high-field fine structure lines from H \perp c is found to increase with the magnitude of the parameters b⁹₂. The observed variations of the ratio of signal intensity is in good agreement with the b⁹₂-dependence of the transition probability.

1. 緒 言

結晶中の磁性イオン (S≥1) は低対称な結晶場中で は結晶電場の影響を強く受け,電子常磁性共鳴(EPR) スペクトルの微細構造として分離した信号が観測される。 その信号強度はマイクロ波振動磁場と磁性イオンの磁気 モーメントとの相互作用に対する遷移確率に比例するこ とが知られている¹⁾。一軸性対称の Cr³⁺(S=3/2) では 外部磁場を対称軸方向にかけたとき分離した信号の遷移 確率は 3:4:3 であり低磁場側と高磁場側とで同じ強度の 信号が観測される。外部磁場を対称軸に垂直にかけた場 合の信号(垂直型EPR信号)ではマイクロ波磁場 H₁の 結晶軸に対する配向により遷移確率が変化する。この遷 移確率の変化は低磁場側と高磁場側の信号強度の違いと して観測される。

Parent と Marshall (1986)²) は立方対称の MgO 結晶 中で最隣接の Mg サイトに Vacancy を伴う正方対称の Cr³⁺中心 (Cr³⁺-V_{Mg} 中心) について信号強度のマイク ロ波磁場 H₁の方向依存性を調べた。正方対称の Cr³⁺- V_{Mg} 中心は,母体の対称性から $Cr^{s+}-V_{Mg}$ 中心の結合軸 (c軸)をそれぞれ [100],[010],[001] 方向にもつ中 心が等価に生成されるために,H \parallel [001],H₁ \parallel [100] で c軸が外部磁場に垂直な信号(垂直型 EPR 信号)を 観測するとH₁ \parallel cの信号とH₁ \perp cの信号が重なって観 測されるので,結晶軸での測定では垂直型EPR信号の 信号強度の違いは観測されない。ParentとMarshallは, 重なりを分離する方向に外部磁場を結晶軸からわずかに ずらして測定を行い,重なりが分離したスペクトルから 高磁場側と低磁場側の信号強度の違いを見い出し,信号 強度のH₁方向依存性を実験的に検出した。

最近,竹内等(1992)³⁾は c 軸に沿って面共有の MgCl₆八面体の直線的な鎖状構造を持つ CsNiCl₈型の 六方晶構造の CsMgCl₈中で V²⁺イオンが一種類の 3 回 対称場中の信号として観測されること,単結晶の劈開面 が c 軸に平行なことに注目し,垂直型 EPR 信号におけ る信号強度の H₁方向依存性の測定を行った。その結果, H₁ || c から H₁ ⊥ c で高磁場側と低磁場側の微細構造の 信号強度が入れ替わる特徴的な H₁方向依存性を見いだ Bulletin of Nagoya Institute of Technology Vol. 46 (1994)



Fig. 1. Unit cell of the hexagonal TlZnF³ crystal structure. Two in equivalent Zn sites are shown in the ZnF³ (site 1) and the Zn²F³ (site 2).

した。この垂直型EPR信号強度の変化は3種類の微細 構造に対する遷移確率を定量的に評価したH₁方向依存 性により明白に説明できることを示した。

最近我々は立方晶ペロブスカイト型構造の高温多形で ある六方晶ペロブスカイト (h-BaTiO 3型)構造 (Fig.1) を持つ, TlZnF₃の単結晶に Cr³⁺をドープした結晶で EPR 測定を行った。その結果六方晶 TlZnF₃:Cr³⁺の結 晶軸(c軸)方向に微細構造の主軸を持ち,b²の大きさ がCsMgCl₃:V²⁺と比較して約 2.5 倍と 3.6 倍の一軸性 対称性を示す Cr³⁺ 中心を観測した。この最大の b^gを 持つ Cr³⁺ 中心の垂直型 EPR 信号で,信号強度の H₁方 向依存性を測定したところ, 高磁場側と低磁場側信号の 強度比が H1 || cと H1 Lcとでそれぞれ約4倍と3倍に も変化する信号強度の異常を観測した。 2 つの Cr³⁺ 中 心における強度比の測定から、この垂直型EPR信号の 強度異常には著しい b2の依存性があることを示してい る。ここではこの垂直型 EPR 信号に表れた強度異常に 注目して,遷移確率の b² 依存性と実験との比較を中心 に述べる。

2. 実 験

六方晶ペロブスカイト構造を持つ TlZnF₃の単結晶は TlF (フッ化第一タリウム)と ZnF₂・4H₂O (フッ化亜 鉛)をそれぞれ等モル混合しさらに CrF₃を 0.3 %モル 混入させた後白金るつぼに入れて Bridgeman 法で作成 した。白金るつぼは 900 ℃まで熱し, 50℃ h⁻¹の早さで



Fig. 2. Electromagnetic field configurations in a TE₀₁₁mode cylindrical resonance cavity.



Fig. 3. The settings of sample crystal in the TE₀₁₁-mode microwave cavity. The XYZ-coodinate system is fixed to the cavity with Z || H and X || H₁. Angle \$\u03c6\$ of the c-axis is defined with respect to the XYZ-coodinate system rotated in the XY plane.

200 ℃の温度まで下げた。得られた結晶は薄く黄緑がかっ た色をして, c軸に垂直な自然面を持つ。EPR スペクト ルの測定は計測分析センターの100kHzの高周波磁場変 調方式による X-band スペクトロメーターを使用して常 温で行った。共鳴点の磁場はプロトンの核磁気共鳴 (NMR)により正確に測定された。試料の温度は銅-コンスタンタンの熱電対で測定した。

Fig. 2 で示すように試料は TE₀₁₁モードを持つマイク ロ波円筒空胴共振器(キャビティ)内で回転させる。 Fig. 3 に示すように外部磁場 H は Z 軸に平行で,マイ クロ波磁場 H₁ は X 軸に平行である。垂直型 EPR 信号 強度の H₁ 方向依存性の測定は Fig. 3 に示すように試料 の c 軸を H \perp c 面内で回転させて行う。マイクロ波磁場 H₁ (H₁ || c) に対する試料の c 軸の回転角を ϕ とする。 試料の c 軸の回転角 ϕ は Fig. 4 の 2 軸回転用 EPR ゴニ オメーターMGM-10 (マイクロデバイス製)を使用し 測定した。

線形が微分型曲線で定義されるとき信号強度は線幅 _ΔH_{pp}の2乗と線形の高さ Imの積に比例する。この比例 定数は吸収線の線型(Gauss型, Lorentz型)によって



Fig. 4. Two-axes EPR goniometer MGM-10(Micro Device) used in rotation about c-axis.

異なる。垂直型 EPR 信号の信号強度の測定では共鳴磁場が常に一定であり線形も変化しないので、c面内における H₁の方向依存性による遷移確率の変化のみを注視することが出来る。ここでは垂直型 EPR 信号の相対的な強度に注目しており、信号強度は線幅 Δ H_{PP}の2乗と線形の高さ I_mの積によって求めた。

3. 結 果

外部磁場 Hを c 軸に垂直にかけたときの H⊥c におけ る EPR スペクトルを Fig. 5 に示す。図中に見られるよ うに微細構造で分離した3種類の中心 A, B, C からの信 号が観測された。得られたスペクトルは結晶の c 面内で 試料を回転しても共鳴点が変化しないことから, c 軸方 向に主軸を持つ一軸性の結晶場中の Cr^{3+} 中心であるこ とを示している。中心 B, C はその EPR 信号の拡がりか ら大きな微細構造を持つ。この結晶では Fig.1 に示すよ うに c 軸に沿って頂点を共有した ZnF₆ の八面体(サイ ト1)と面共有の Zn₂F₉ の八面体(サイト2)を持ち, Zn²⁺ サイトはどちらも3回対称性を持つことから, ス ペクトルは2つの異なった Zn²⁺ サイトに置換された Cr³⁺ 中心の他に, c 軸上の近傍に電荷補償を伴う Cr³⁺ 中心からの信号で母体の3回対称性を反映したものも含 まれる。

3回対称性の結晶場における Cr³⁺の垂直型 EPR ス ペクトルは H || Z として次のスピンハミルトニアン

$$\mathscr{H} = g_{\perp} \beta H_z S_z + \frac{1}{3} b_2^0 \left[3S_x^2 - S \left(S + 1 \right) \right]$$
(1)

で記述される⁴⁾。ここでS = 3/2, β は Bohr 磁子であ



Fig. 5. Observed EPR spectra of the trigonal Cr³⁺ centres in h-TlZnF₃ at the room temperature with a) H₁ ∥ c and b) H₁⊥c. The c-axis keeps normal to the external magnetic field.

Table 1. Experimental values of the spin-Hamiltonian parameters. Units in 10^{-4} cm⁻¹ for b⁹₂.

Crystal	Ion	Centre	T(K)	g١	g⊥	b ^o ₂
TlZnF₃	Cr ³	* A	297	1.9723(2)	1.9730(2)	$\pm 78.8(3)$
		В	297	1.9692(2)	1.9708(2)	$\pm 2387.0(2)$
		С	297	1.9750(2)	1.9727(2)	$\pm 3496.9(2)$
CsMgCl ₃	V²	+ 3)	302	1.9729(1)	1.9747(2)	+965.0(3)

り, b² は微細構造パラメーター, X軸は3回対称結晶場 を反映した微細構造項の主軸の方向を表す。 H \perp c 面内 での測定は共鳴磁場が極大であることを利用し, 最良の セッティングで行った。得られたパラメーターの値は竹 内等³⁾の CsMgCl₃ 中の V²⁺ 中心の値とともに Table. 1 に示す。Table. 1 に見られるように,中心B,C の b² の 値は CsMgCl₃ : V²⁺ と比較してそれぞれ約2.5倍, 3.6 倍となっている。この中心 B,C の垂直型 EPR 信号の高 磁場側と低磁場側の信号強度に着目して, H₁ 方向依存 性の測定を行った。 H \perp c 面内の測定でマイクロ波振動磁場 H₁ と c 軸と の関係が H₁ || c のときの EPR スペクトルを Fig. 5 (a) に, H₁ \perp c における EPR スペクトルを Fig. 5 (b) に示 す。中心 B, C の垂直型 EPR 信号について,低磁場側の 信号と高磁場側の信号強度が H₁ || c のときと H₁ \perp c の ときとで大きく変化している。図に見られるように中心 B, C の低磁場側の信号強度は H₁ || c と H₁ \perp c のときと で著しく増大しているのに対して,高磁場側信号では逆 にそれぞれ著しく減少する。

高磁場側と低磁場側の信号強度比の中心 B, C との違いにに着目すると、 $H_1 \parallel c$ のとき中心 B, C の高磁場側の信号強度を低磁場側と比較して、それぞれ約3.6倍、4.6倍に、 $H_1 \perp c$ のとき中心 B, C の低磁場側の信号強度が高磁場側と比較して、それぞれ約2.7倍、3.3倍と増大しており、垂直型 EPR 信号で観測された信号強度異常に b⁹ 依存性があることを示している。

4. 解 析

4.1 垂直型 EPR 信号における遷移確率と信号強度

3回対称の Cr³⁺ 中心における垂直型 EPR 信号の状 態 ψ_i と ψ_i準位間の遷移確率は

$$T_{ii} = |\langle \psi_i | \beta H_1 \cdot g \cdot S | \psi_i \rangle|^2$$
(2)

で表される。ここで H_1 はマイクロ波の振動磁場を表す。 H⊥cのときの Cr^{3+} の固有状態は $H \parallel c$ での固有状態 $\mid M >$ に結晶場により $\mid M-2 >$ または $\mid M+2 >$ の状 態が混在する。これが遷移確率の変化の原因となる。こ こでマイクロ波振動磁場 H_1 と外部磁場 $H \in H_1 \perp H$ に 保ちながら $H_1 \parallel c$ ($\phi = 0^\circ$)から $H_1 \perp c$ ($\phi = 90^\circ$)ま でかえる場合の遷移確率を求める。

外部磁場 Hを c 軸に垂直にかけたときの Cr³⁺ の電子 状態 ψ_i (i=1-4) は式 (1) のスピンハミルトニアンか ら次のように求められる。

$$|\psi_{1}\rangle = \cos \alpha |+ \frac{3}{2}\rangle + \sin \alpha |- \frac{1}{2}\rangle$$

$$|\psi_{3}\rangle = -\sin \alpha |+ \frac{3}{2}\rangle + \cos \alpha |- \frac{1}{2}\rangle$$

$$|\psi_{4}\rangle = \cos \gamma |- \frac{3}{2}\rangle + \sin \gamma |+ \frac{1}{2}\rangle$$

$$|\psi_{2}\rangle = -\sin \gamma |- \frac{3}{2}\rangle + \cos \gamma |+ \frac{1}{2}\rangle$$

$$\subset \subset \varepsilon \in = b_{2}^{0}/g_{\perp}\beta H \succeq \cup \subset,$$
(3)

$$\cos 2 \alpha = (2 - \varepsilon)/2\sqrt{(1 - \varepsilon + \varepsilon^{2})}$$

$$\sin 2 \alpha = \sqrt{3} \varepsilon/2\sqrt{(1 - \varepsilon + \varepsilon^{2})}$$

$$\cos 2 \gamma = (2 + \varepsilon)/2\sqrt{(1 + \varepsilon + \varepsilon^{2})}$$

$$\sin 2 \gamma = -\sqrt{3} \varepsilon/2\sqrt{(1 + \varepsilon + \varepsilon^{2})}$$

(4)

である。

♦の依存性は

$$\beta H_1 \cdot \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{S} = \beta g_{\perp} (H_1 \cos \phi (S^+ + S^-)) -iH_1 \sin \phi (S^+ - S^-))/2$$
(5)

を通して現れる。この時 $|\psi_1 > \leftrightarrow |\psi_2 >$, $|\psi_2 > \leftrightarrow$ $|\psi_3 >$, $|\psi_3 > \leftrightarrow |\psi_4 > o$ 遷移確率はそれぞれ

$$T_{12} = (\beta H_1 g_{\perp}/2)^2 (3c_3^2 + 4s_1^2 c_2^2 + 4\sqrt{3} s_1 c_2 c_3 \cos 2\phi) T_{23} = (\beta H_1 g_{\perp}/2)^2 (3s_3^2 + 4c_1^2 c_2^2 - 4\sqrt{3} c_1 c_2 s_3 \cos 2\phi)$$
(6)
$$T_{34} = (\beta H_1 g_{\perp}/2)^2 (3c_2^2 + 4c_1^2 s_2^2 + 4\sqrt{3} c_1 s_2 c_3 \cos 2\phi)$$

と求められる。ここで $c_1 = \cos \alpha$, $s_1 = \sin \alpha$, $c_2 = \cos \gamma$, $s_2 = \sin \gamma$, $c_3 = \cos(\alpha + \gamma)$ と $s_3 = \sin(\alpha + \gamma)$ である。

TIZnF₃:Cr³⁺の中心Cについて,H₁の方向をH₁ | c ($\phi = 0^{\circ}$)からH₁⊥c($\phi = 90^{\circ}$)に変えたときの垂直型 EPR 信号の高磁場側と低磁場側の信号強度変化を Fig. 6に示す。ここで〇印は高磁場側,□印は低磁場側 の信号強度を表す。図に見られるようにH₁ || cでは高磁 場側の信号強度が低磁場側と比較して約4.6倍に対して, H₁⊥cでは逆に約1/3.3に減少している。Fig. 6中の実 線はTable.1のb⁹の値およびg₁から(6)式を使って 求めた遷移確率の理論値を示す。図に見られるように測 定値と理論値とは良く一致している。この結果は垂直型 EPR 信号の強度変化の ϕ 依存性が遷移確率の変化によ り現れることを明確に示している。

4.2 信号強度のb⁹ 依存性

Fig. 5の中心 A, B, C に見られるように信号強度の絶対値は結晶中の濃度の違いを反映する。しかし垂直型 EPR 信号の低磁場側と高磁場側の強度比は相対的なものであり磁性中心の違いにかかわらず比較できる。 TlZnF₃:Cr³⁺の中心 B, C の測定からこの強度比に b³ 依存性が現れる。この b³ 依存性を遷移確率の立場から 検討する。遷移確率の b³ 依存性は(6)式に見られるよ



Fig. 6. Angular dependences of intensities of the lowfield signal (□) and high-field signal (○) for centre C from H₁ || c to H₁⊥c in the H⊥c plane. Fullcurves are calculated ones using equation(6).

うに ϵ (=b²/g₁ β H)を通して現れる。ここでは遷移確 率 T12, T34 のうち大きい方を T>, 小さい方を T< とし て遷移確率比(T>/T<)を(6)式を使って計算し、X-バ ンド測定における遷移確率比の bg 依存性を Fig. 7 に示 す。ここで実線はH1 ∥cのときの, 波線はH1⊥cのと きのそれぞれの遷移確率の比を表す。図中にはこれまで に観測された TlZnF₃:Cr³⁺の中心 A, B, C(○印)と CsMgCl₃:V²⁺ (●印)³⁾についての垂直型 EPR 信号の 低磁場側と高磁場側の信号強度比(強信号強度/弱信号 強度≥1)を表す。TlZnF₃:Cr³⁺の中心 B,Cでは Fig.5 の垂直型 EPR 信号に見られるように、H1 || c のときは 中心B,Cとも高磁場側の信号強度が低磁場側よりも強 いため,遷移確率比(T>/T<)は信号強度比(高磁場側 信号強度/低磁場側信号強度)に対応しており、H₁⊥c のときは逆に高磁場側の信号強度が低磁場側と比較して 弱くなるために、遷移確率比は信号強度比(低磁場側信 号強度/高磁場側信号強度)に対応している。Fig.7に 見られるように中心 B,Cの信号強度比は H₁ || c でそれ ぞれ約3.6倍, 4.6倍に, H1⊥cでそれぞれ約2.7倍, 3.3 倍と b2の値とともに増大している。H1 || c と H1 上cの それぞれの場合について竹内等³⁾のCsMgCl₃:V²⁺の結 果も含めて実験から求めた信号強度比は遷移確率比の



Fig. 7. The b²-dependence of ratio(T>/T<) of intensities between the low-field and high-field signals from H₁ || c and H₁⊥c in the H⊥c plane.

b[§] 依存性の計算結果と良い一致を示す。この結果は b[§] の大きさの違う 3d^³ 中心の垂直型信号で観測された信号 強度比の信号強度異常が遷移確率の変化で説明できるこ とを示している。

5.考察

TlZnF₃:Cr³⁺の試料をH⊥c面内で2軸ゴニオメーター を使用して,H₁ || cからH₁⊥c方向へc軸の回転で測定 した垂直型 EPR スペクトルの信号強度の特徴的な変化 はマイクロ波磁場H₁の方向からのc軸の傾き ϕ による 遷移確率の角度依存性で説明された。b²の符号にかか わらず垂直型 EPR の信号強度が高磁場側では $\phi = 0^{\circ}$ で 強く低磁場側では $\phi = 90^{\circ}$ で強くなることから,垂直型 EPR の信号強度測定はマイクロ波キャビティ中のc軸 方向の決定に使用すると有効である。垂直型 EPR 信号 の低温での信号強度測定による b²の符号の決定では, EPR の信号強度のマイクロ波磁場H₁とc軸とのなす角 度 ϕ の依存性を十分に考慮する必要がある。また Fig. 7 のように高磁場側と低磁場側の信号強度比が b²の値に より著しく変わることから,信号強度の弱い垂直型 EPR スペクトルの同定に当たって, c軸をH₁ || c, H₁ ⊥cと変えることにより低磁場側,高磁場側の信号強 度を選択的に増やすことができる。この効果を利用する と信号強度の弱い磁性中心の同定が可能となる。

6. 結 言

垂直型 EPR の信号で観測された信号強度の異常な変 化は,遷移確率の∮および b⁸ 依存性から明確に説明で きることを示した。この信号強度の変化は c 軸方向の決 定に有効な手法であり,信号強度の弱い共鳴線の中心の 同定にも有効である。 文 献

- A.Abragam and B.Bleaney: Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions, Clarendon Press., Oxford 1970.
- M.G. Parent and S.A. Marshall: J. Magn. Reson.
 68 (1986) 112-20.
- H.Takeuchi and H.Tanaka: J. Phys.: Condens. Matter 4 (1992) 10071-8.
- 4) J.W. Orton: *Electron Paramagnetic Resonance*, Iliffe Books Ltd., London 1968.